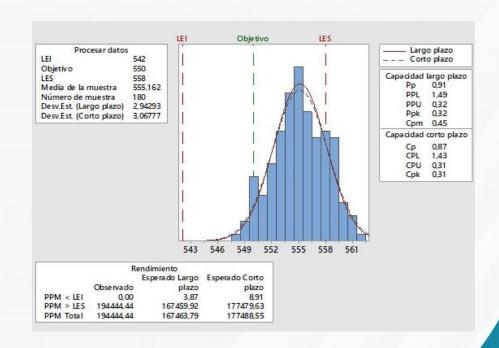




Control Estadístico del Proceso









011

La recolección de datos y el uso de métodos estadísticos no es el fin

Los Sistemas de Medición son críticos para el análisis de datos, estos deben ser claramente conocidos antes de iniciar el proceso de recolección de datos

02



03

El uso de señales estadísticas para mejorar el desempeño puede ser aplicado en cualquier área



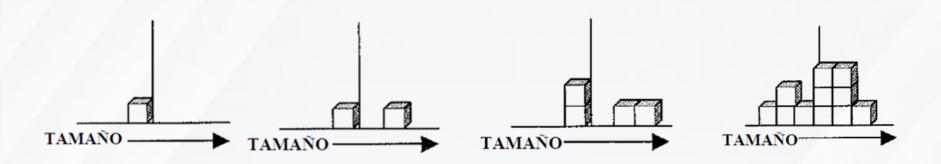
El real entendimiento de los conceptos estadísticos requiere del contacto directo con situaciones de control de procesos



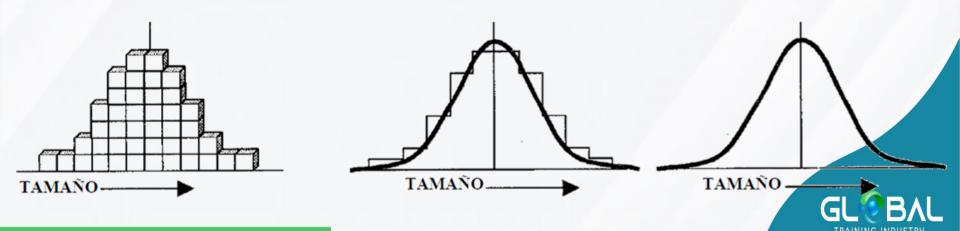
El manual SPC debiese ser la referencia de 1er paso hacia el uso de métodos estadísticos



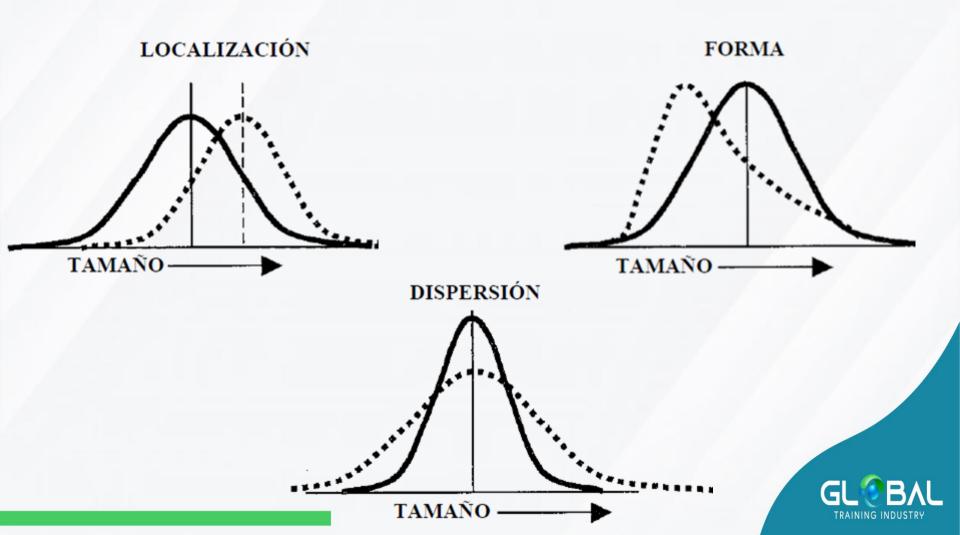
Las Piezas Varían una de Otra



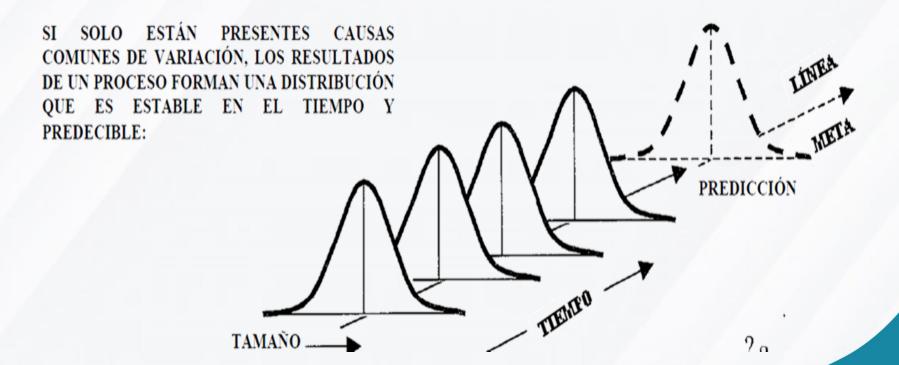
AUNQUE FORMEN UN PATRÓN, QUE SI ES ESTABLE, PUEDE SER DESCRITO COMO UNA DISTRIBUCIÓN



La Distribución puede diferir en:

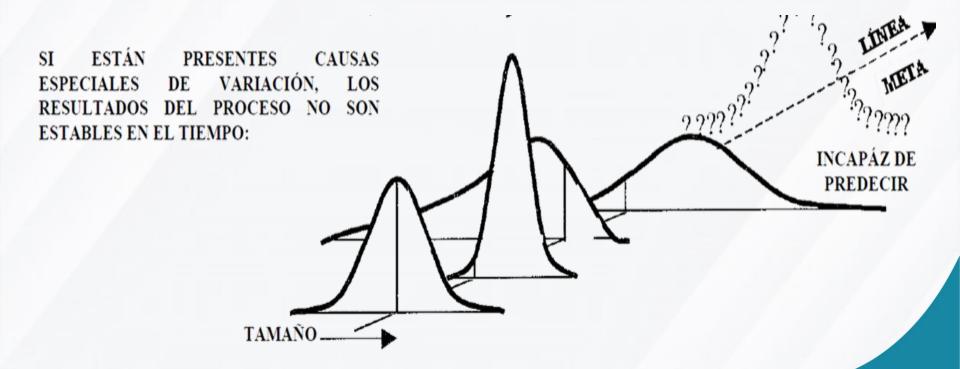


Causas Comunes



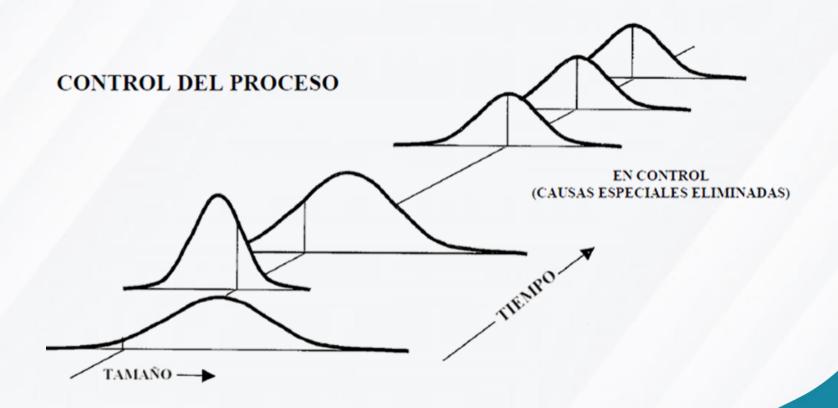


Causas Especiales





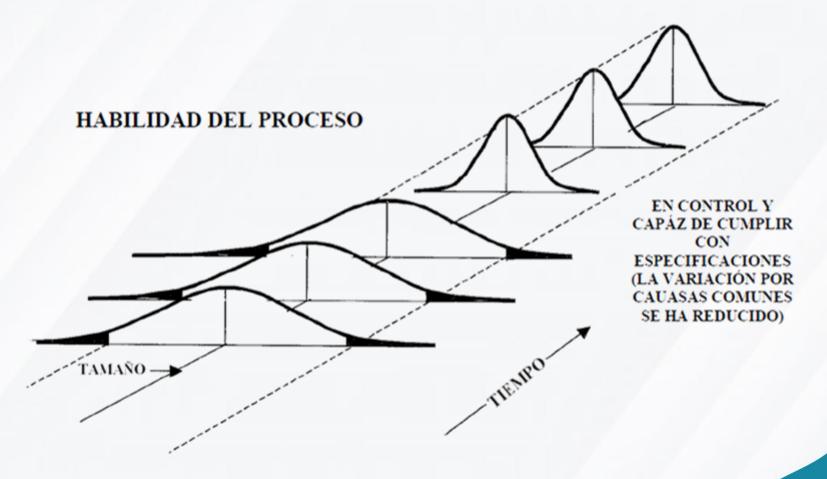
Control De Proceso



FUERA DE CONTROL



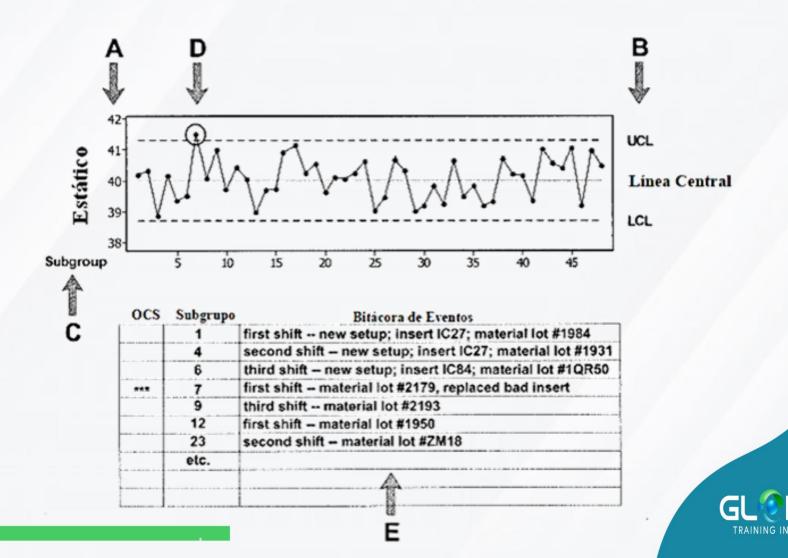
Habilidad del Proceso



EN CONTROL PERO NO CAPÁZ DE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES (LA VARIACIÓN POR CAUSAS COMUNES ES EXESIVA)

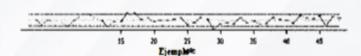


Elementos De Graficas De Control



Elementos De Graficas De Control

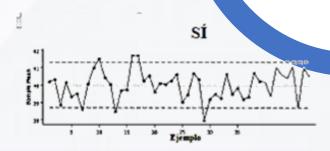
NO





Escala apropiada

La escala debiera ser tal que la variación natural del proceso pueda ser fácilmente vista. Una escala que produzca una gráfica de control "estrecha" no permite análisis ni control del proceso mismo.



Limites de Control

La habilidad de determinar indicadores que den señales de causas

especiales en las gráficas de control requiere que los límites de

control se basen en una distribución muestral.

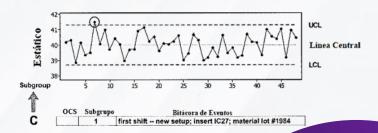
В

Línea Central

La gráfica de control requiere de una línea central basada en la distribución muestral, a fin de permitir la determinación de patrones no aleatorios que den señales de causas especiales.



Elementos De Graficas De Control



Secuencia de tiempo de subgrupos

Manteniendo la secuencia en la cual los datos son recolectados ofrece indicaciones de "cuándo" ocurre una causa especial y si dicha causa está orientada en el tiempo.



<u>Identificación de valores fuera</u> de control

Puntos graficados que estén fuera de control estadístico debieran estar identificados en la gráfica de control.



Esta información debiera incluir fuentes potenciales de variación, así como acciones tomadas para resolver señales fuera-de-control

(OCS). Esta información puede registrarse en la gráfica de control o en una Bitácora de Eventos por separado..



	Resumen de Criterios Típicos para Causas Especiales
1	1 punto más allá de 3 desviaciones estándar ²¹ de la línea central
2	7 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central
3	6 puntos consecutivos, todos crecientes ó todos decrecientes
4	14 puntos consecutivos, alternando arriba y abajo
5	2 de 3 puntos > 2 desviaciones estándar de la línea central (mismo lado)
6	4 de 5 puntos > 1 desviación estándar de la línea central (mismo lado)
7	15 puntos consecutivos dentro de 1 desviación estándar de la línea central (ambos lados)
8	8 puntos consecutivos > 1 desviación estándar de la línea central (ambos lados)



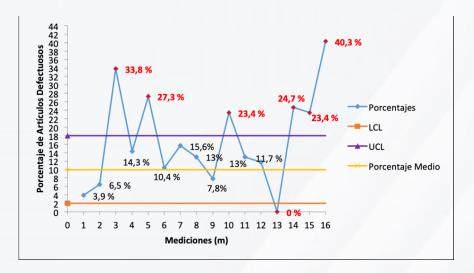
Determinación De Grafica

Variables atos

Medias y rangos X-R

Promedios y Desviaciones X-S

Promedios y Rangos Móviles (X-MR)









Graficas Por Variables

Determinación De Grafica

Grafica p

Grafica np

Grafica u

Grafica c



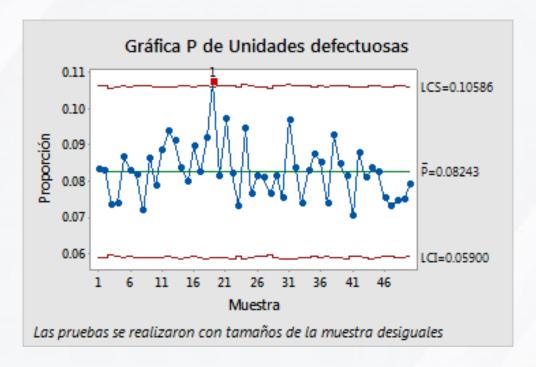


Sample



Datos no Variables

Tradicionalmente las gráficas de atributos son usadas para el rastreo de partes no aceptables identificando productos no conformes y no conformidades dentro de un producto mismo.



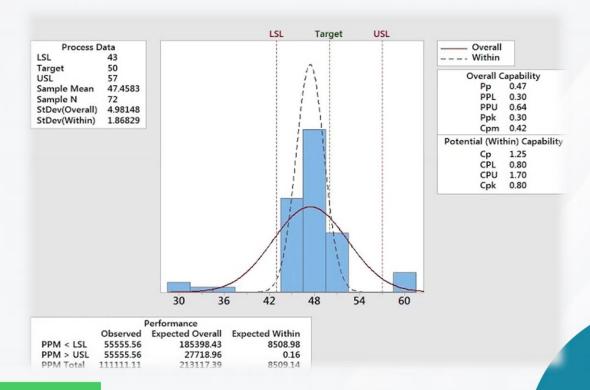






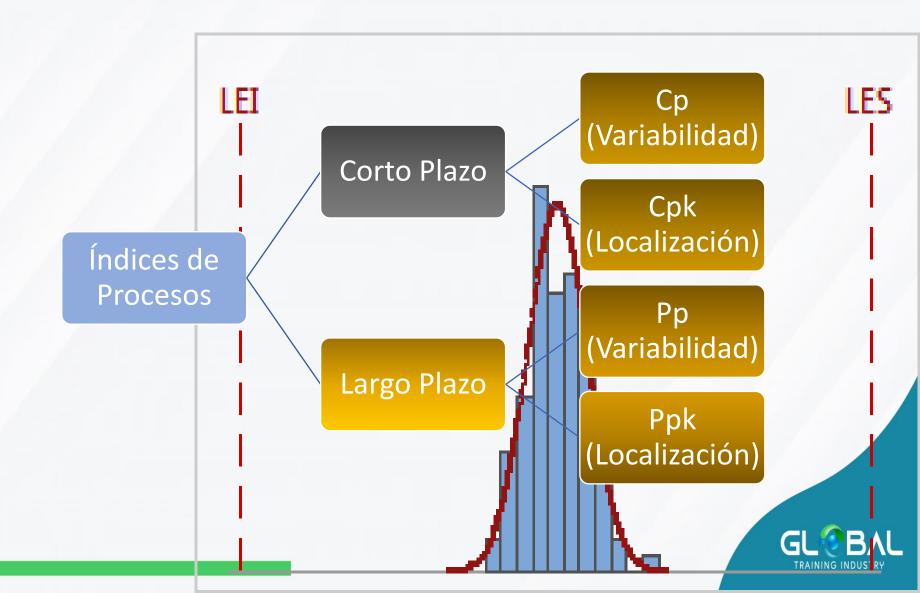
Índices de Procesos

El resultado de un proceso estable puede ser descrito por su distribución estadística. El proceso debe ser estable (en control estadístico) a fin de que su distribución sea útil para predecir resultados futuros.





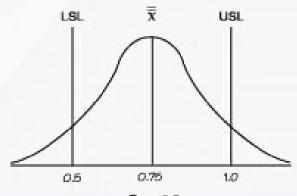
Índices de Procesos

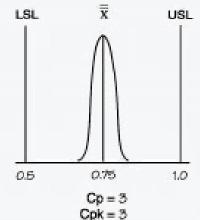


CP

 Indicador de la capacidad potencial del proceso que resulta de dividir el ancho de las especificaciones (variación tolerada) entre la amplitud de la variación natural del proceso.

$$C_p$$
 se calcula por $C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_c} = \frac{USL - LSL}{6(\overline{R}/d_2)}$





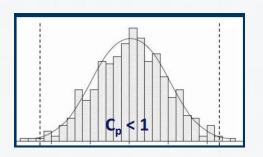


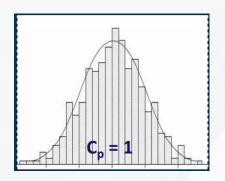
Propiedades del Índice de capacidad del proceso:

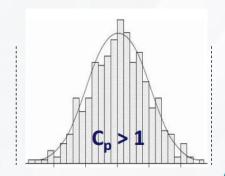
Cp < 1, La variación del proceso excede la especificación → Se están generando defectos

Cp = 1, El proceso satisface la especificación. Se obtendrá un mínimo de 0.27% de defectos y mas si el proceso no esta centrado.

Cp > 1, La variación del proceso es inferior a las especificaciones, sin embargo se obtendrá defectos si el proceso no esta centrado en el valor deseado.

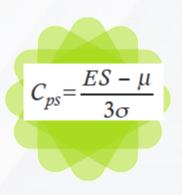


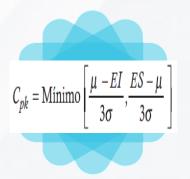


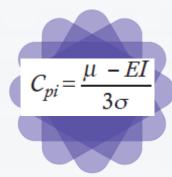




Cpi, Cps, Cpk







Cps

Indicador de la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación superior de una característica de calidad.

Cpi

Indicador de la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación inferior de una característica de calidad.

Cpk

Indicador de la capacidad real de un proceso que se puede ver como un ajuste del indice *Cp* para tomar en cuenta el centrado del proceso.



Cpi, Cps, Cpk

- El índice Cpk siempre va a ser menor o igual que el índice Cp. Cuando son muy próximos, eso indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las especificaciones, por lo que la capacidad potencial y real son similares.
- Si el valor del índice Cpk es mucho más pequeño que el Cp, significa que la media del proceso está alejada del centro de las especificaciones. De esa manera, el índice Cpk estará indicando la capacidad real del proceso, y si se corrige el problema de descentrado se alcanzará la capacidad potencial indicada por el índice Cp.



Cpi, Cps, Cpk

- Cuando el valor del índice Cpk sea mayor a 1.25 en un proceso ya existente, se considerará que se tiene un proceso con capacidad satisfactoria. Mientras que para procesos nuevos se pide que Cpk > 1.45.
- Es posible tener valores del índice Cpk iguales a cero o negativos, e indican que la media del proceso está fuera de las especificaciones.



Pp Y Ppk

 La capacidad de largo plazo se calcula con muchos datos tomados de un periodo suficientemente largo como para que los factores externos influyan en el desempeño del proceso.

$$P_p = \frac{ES - EI}{6\sigma_L}$$

$$P_{pk} = \min \left[\frac{\mu - EI}{3\sigma_L}, \frac{ES - \mu}{3\sigma_L} \right]$$

